DIN EN ISO 25178-604:2013-12 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft - Teil 604: Merkmale von berührungslos messenden Geräten (Weißlicht-Interferometrie) (ISO 25178-604:2013); Deutsche Fassung EN ISO 25178-604:2013

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Begriffe 5
2.1 Begriffe, die sich auf alle flächenhaften Verfahren zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit beziehen 5
2.2 Begriffe, die sich auf die x- und y-Abtastsysteme beziehen 11
2.3 Begriffe, die sich auf optische Systeme beziehen 12
2.4 Begriffe, die sich auf die optischen Eigenschaften des Werkstücks beziehen 14
2.5 Spezifische Begriffe zur Weißlicht-Interferometrie-Mikroskopie 15

3 Beschreibungen der Einflussgrößen 18
3.1 Allgemeines 18
3.2 Einflussgrößen 19

Anhang A (informativ) Überblick und Komponenten eines Weißlicht-Interferometrie-Mikroskops (CSI-Mikroskops) 21

Anhang B (informativ) Theorie der Arbeitsweise der Weißlicht-Interferometrie (CSI) 26

Anhang C (informativ) Räumliche Auflösung 34

Anhang D (informativ) Beispielverfahren zur Abschätzung der Wiederholpräzision der Oberflächentopographie 38

Anhang E (informativ) Zusammenhänge mit dem GPS-Matrix-Modell 39

Literaturhinweise 40